

各 位

(社) 電子情報技術産業協会
AV 安全技術専門委員会
委員長 松島 実

「JIS C 6065:2007 対応 試験・検査ガイドブック」セミナー開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は当委員会の活動にご協力賜り厚くお礼申し上げます。

電子機器の安全規格として、日本では IEC 60065 第 7 版の整合規格 JIS C 6065:2007 が昨年 8 月に発行されました。この JIS 規格は今年、強制定法規（電気用品安全法省令第 2 項基準）として採用される予定であります。

当委員会では、従来から実務者向けの「試験・検査ガイドブック」の作成を行っており、この度、「JIS C 6065:2007 対応 試験・検査ガイドブック」を発行するに至りました。

本ガイドブックをより正しく有効に活用していただくため、今回、標記セミナーを開催いたします。セミナーでは、実際に設計や試験を行う上での留意点や、今回の主たる改正点である空間・沿面距離を中心に説明を行います。

つきましては、貴社、設計技術部門や管理部門など関係者各位に当セミナーをご案内いただき、多数のご参加を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 平成 20 年 1 月 29 日（火） 13:30～17:00（13:00 開場）
2. 場所 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 1 階 102 室
東京都渋谷区代々木神園町 3 番 1 号
現地までの地図 <http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html>
センター棟の配置図 <http://nyc.niye.go.jp/facilities/d6-1.html>
3. プログラム（予定）
 - 1) ガイドブックの使い方、日本デビエーションの説明（20 分）
 - 2) 空間距離及び沿面距離の説明（90 分）
 - 3) 危険な放射の説明（20 分）
 - 4) 通常動作状態での感電の危険、機械的強度の説明（40 分）講師：AV 安全技術専門委員会 規格・基準検討 WG 委員
4. 受講料 4,000 円／人（消費税込み）
*当日会場にて申し受けるとともに領収書を発行いたします。
請求書の発行はいたしませんので、ご了承ください。
5. 定員 150 名（定員になり次第受付を締め切らせていただきます。）
6. 参加申込受付
1 月 18 日（金）までに、別紙申込書により F A X にてお申し込みください。なお、参加証の発行はいたしませんので、当日はお送りいただいた申込書を受付にご提示ください。
7. 「JIS C 6065:2007 対応 試験・検査ガイドブック」の頒布
頒布価格：6,000 円（消費税込み）／冊にて当日販売いたします。
（セミナー当日を除き JEITA 会員以外は 12,000 円での頒布となります。）
当日ご購入を希望される方は、参加申込書に購入冊数をご記入ください。

問合せ先事務局 (社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) 総合企画部 (安全担当 内田)
E-mail: m-uchida@jeita.or.jp
TEL: 03-5275-7256

以上